**附件3.**

**1、设备用途**

电子变像探测系统基于电子光学原理，可以实现对微弱回波信号时域上进行波形采样、空域上成像分辨。与传统二维面阵探测器相比，电子变像探测系统可同时实现时间分辨和空间分辨。

**2、设备工作环境**

工作温度： 0℃ ~ +40℃

相对湿度： 10%~60%

**3、技术指标要求**

该系统具体用于激光雷达收发匹配测试。经过整形的激光信号经发射光学系统发射至远距离目标，目标返回的信号经接收光学系统滤波并收集后由电子变像探测系统探测，同时解析得到回波的波形信息和空间分辨信息，通过该信息，可以评价激光整形发射及接收的匹配情况。

鉴于以上需求，现要求技术指标如下：

* 成像帧频：1-2KHz；
* 光敏面：≥3×10mm；
* 空间分辨率：优于20lp；
* 时间分辨率：1ns
* 响应波长：400-600nm
* 触发方式：SMA接口，5V（50欧）
* 控制方式：程控，RS232或RS422

供货周期为：2个月。

保修期一年，激光器出现问题24小时内有响应。